Al をドープした anatase 型二酸化チタン単結晶の紫外光照射下での ESR

竹田康浩^A、関谷隆夫^{A,B}、大屋翔平^A、小平哲也^B 横浜国立大学大学院 工学研究院^A 産業技術総合研究所 ナノシステム研究部門^B ESR of UV-irradiated Al-doped Titanium Dioxide Single Crystal Y. Takeda^A, T. Sekiya^{A,B}, S. Ohya^A, T. Kodaira^B Faculty of Engineering, Yokohama National University^A Nanosystem Research Institute, AIST^B

ESR measurement under uv light irradiation was performed on Al-doped anatase TiO₂ crystals grown by chemical vapor transport method. In as-grown crystal, characteristic ESR sextuplet signals are observed at temperatures of 100-40 K. The intensities of the sextuplets reduce gradually with decrease in temperature. The sextuplet arising from a paramagnetic species of S=1/2 interacting with I=5/2 is due to a photogenerated hole interacting with doped Al. The angular dependence of the sextuplet is successfully explained by a model where symmetrically equivalent four paramagnetic species giving the sextuplet are present in the crystal and the principal *z*-axis of a diagonal **g**-matrix for the paramagnetic species has a small deviation from the crystalline *c*-axis. Analysis for angular dependence of the sextuplets gives anisotropic *g*-values of $g_{xx}=2.0254$, $g_{yy}=2.0016$, $g_{zz}=2.0129$, and hyperfine coupling constants of $A_{xx}=4.93$ $A_{yy}=6.04$ $A_{zz}=5.98$ G. EPR signal due to bulk Ti³⁺ is also observed at temperatures below 40K regardless of uv irradiation. While, annealed crystal has no signal corresponding to bulk Ti³⁺ and sextuplet is observed at temperatures below 70 K. These experimental results are largely different from as-grown crystal.

1.はじめに

光触媒反応は、触媒材料に照射された光が内部で吸収 され、それにより生成されたキャリアが表面に移動して おこる反応である。近年光触媒材料等で注目を集めてい る二酸化チタンには。rutile、anatase、brookite の 3 つの 同質多型があり、中でも anatase 型は光触媒効率の高さ から注目されている。われわれは、不純物の積極的なド ープのない anatase 型二酸化チタン単結晶を育成し、そ の単結晶を水素、酸素雰囲気下で熱処理することによっ て酸素欠陥の量を制御することに成功している。その中 で、もっとも欠陥が少ないとされる無色透明の単結晶 (colorless 結晶)を用いて紫外光照射下において ESR 測定 を行った。その結果、3315~3385Gauss、100~40K にお いて6本の対称なシグナル(sextuplet)が観測された(Fig. 1 シグナル B、B')[1]。本研究では、その sextuplet シグ ナルの起源が不純物として含まれた Al であると考え、 積極的に Al をドープした単結晶を育成し ESR 測定を行 った。また、酸素熱処理の前後での ESR の変化も測定 した。



Fig. 1 ドープのない無色透明の anatse 型単結 晶の 紫外光照射 ESR の温度依存性

2.実験

Chemical Vapor Transport 法により AI をドープした anatase 型二酸化チタン単結晶を育成した。rutile 型二 酸化チタン粉末に、Al(OH)₃ を濃度が 5mol%となるように混合した粉末を焼成し、AI を固溶させた rutile 相の粉末を単結晶育成原料として用意した。2mol%ドープした単結晶の育成原料としては、これに rutile 型二酸化チタン粉末をさらに加えることで AI の濃度が 2mol%となるように調節した。NH₄CI を輸送剤と して加えた粉末を真空封入し、温度勾配を持つ水平管状炉で 2~3 週間保持した。得られた単結晶は、角 度依存性を測定するために X 線回折によりその方位を測定し、(100)、(001)面に研磨を施して整形した。 ESR 測定では X バンドマイクロ波を用いた。紫外光照射 ESR にはピーク波長が 365nm の LED (日亜化学 NSHU591B)を用いて、キャビティ中にセットされた試料に照射することで実現した。サンプルの温度は クライオスタット(Oxford GFS600)と温度調整機を用いて制御し、10K から室温まで温度可変とした。角 度依存性はゴニオメータによってサンプルを回転させることにより測定した。また、AI を 2mol%ドープし

た単結晶は一度 ESR 測定を行った後、酸素雰囲気下 1Mpa、800 で 60h 熱処理を施したのちに再び ESR 測定 を行い、酸素熱処理の前後でのシグナルの変化を観測した。

3.結果と考察

Fig. 2 は Al を 5mol%ドープした anatase 型単結晶の紫 外光照射下における H//a での ESR の温度依存性である。 Al ドープのない anatase 型単結晶とほぼ同じ 3380G 付近 に単一のシグナル A が観測された。これは温度が下がる につれて強度が増し、高磁場側にシフトした。またこの シグナルは紫外光照射のない状態でも観測される。この ことから、これは光照射と関係のない欠陥に起因するシ グナルであると考えられる。

100K~60K では Al ドープのない無色透明の anatase 型 単結晶と同じように二組の sextuplet シグナル B、B'が観 測された。この sextuplet シグナルが等強度、等間隔であ ることから、これらはスピン S=1/2 に対する核スピン $I_N=5/2$ の超微細構造分裂によるものと考えられる。シグ ナル B、B'について、90K における角度依存性を測定し た。Fig. 3 は(ab)、(ac)面内での回転における角度依存性 を示している。この図から、(ab)面内における回転では、 90°回転するごとに B と B'が入れ替わる。(ac)面内の回 転では、低磁場側の 6 本のシグナルが 12 本に分裂する ことが分かる。(たとえば 75°のスペクトル)さらに高磁 場側のシグナルの強度は、分裂した低磁場側のものの約





2 倍ある。このことから、sextuplet シグナルを与えるスピンは 2 個ではなく、結晶中に 4 個存在している と考えられる。(ab)面内の回転では 2 つは等価であり、(ac)面内の回転では高磁場側のものだけが等価とな るようなモデルとして Fig. 4 を考えた。4 つの電子スピンの主軸方向がそれぞれ δ だけ傾いていると考え た。

Fig. 5 は(ab)回転、(ac)回転それぞれでの *g* 値と超微細結合定数(hfc)*A* の角度変化である。sextuplet シグナ ルを与えるスピンが 4 個あるとして、*g* 値、*A* の解析を行った。 $g = \begin{bmatrix} {}^{t}\mathbf{n} \cdot {}^{t}\mathbf{R} \cdot (\mathbf{g}_{D} \cdot {}^{t}\mathbf{g}_{D}) \cdot \mathbf{R} \cdot \mathbf{n} \end{bmatrix}^{1/2}$ を用いて *g* 値の fitting を行った結果、*g* 値はおよそ

 $(g_{xx}, g_{yy}, g_{zz}) = (2.0254, 2.0016, 2.0129)$

となった。ただし、Rは結晶軸とスピンの主軸のずれのために導入したδを含む回転テンソルである。





Fig. 3 90K での (ab)面内の回転での角度依存性

また、超微細結合定数 (hfc)A についても $A = \begin{bmatrix} {}^{t}\mathbf{n} \cdot {}^{t}\mathbf{R} \cdot (\mathbf{A}_{\mathrm{D}} \cdot {}^{t}\mathbf{A}_{\mathrm{D}}) \cdot \mathbf{R} \cdot \mathbf{n} \end{bmatrix}^{1/2}$ を用いて解析を行った。その 結果

 $(A_{xx}, A_{yy}, A_{zz}) = (4.91, 6.04, 5.98)$

となった。この結果から結晶軸とスピンの主軸のずれ δ は8.6°となった。

ここで、sextuplet シグナルの起源をイオン半径の観点か ら考えてみる。Ti⁴⁺とAl³⁺の配位数6のイオン半径は $Ti^{4+} = 0.61[\text{\AA}] \text{ Al}^{3+} = 0.54[\text{\AA}]$

である Ti⁴⁺に置換する形で Al³⁺が存在しているとすると、 イオン半径がもとの Ti⁴⁺のイオン半径よりも小さいので



dI/dH

Magnetic Field (Gauss) (ac)面内の回転での角度依存性



Fig. 4g、A テンソルの主軸方向のモデル図



Fig. 5 (ab)、(ac)面内の回転における g 値 A 値の角度変化 左): (ab)面内での回転 右): (ac)面内での回転

280

Ti⁴⁺の占める八面体の中心の位置からずれて存在することができ、4 種類の電子スピンの起源となることが できると考えられる。このことからも、シグナル B、B'の起源は²⁷Al と考えられる。またこの時、Al³⁺は TiO₆八面体中で、電気的中性を保つ要請から h⁺をトラップしていると考えられる

40K 以下で見られるシグナル C は 3385G に観測され、共鳴磁場が同じであるから無色透明の anatase 型 結晶で観測されるものと同じであると考えられる。

シグナル C の角度依存性を測定し、g値の解析を行った結果

 $g_{aa} = g_{bb} = 1.990$, $g_{cc} = 1.960$

となった。これは、anatase 型二酸化チタン粉末中の Ti³⁺によるシグナルとして以前に報告されたバルク中の g値[2]⁾

$$g_{aa} = g_{bb} = 1.990$$
 $g_{cc} = 1.960$

に一致している。このことから低温ではバルク中の Ti⁴⁺に不対電子がトラップされ Ti³⁺となっているもの

が存在すると考えられる。[1] しかし、Al を 5mol%ドープした anatase 型単結晶ではシグナル C は温度の低下とともに強度が増し、鋭くなっ ている。また、紫外光照射のない状態で観測さ れるという点ではドープのない無色透明な anatase 型単結晶とは異なっている。

Fig.6 に酸素雰囲気下 1Mpa、800 で 60h 熱処 理を施した Al を 2mol%ドープした anatase 型二 酸化チタン単結晶の H//a における温度依存性を 示す。シグナル A は酸素雰囲気下での熱処理を 行っていないものと同様に観測されている。シ グナル B については、同じように観測されてい るが、観測される温度領域が大きく異なってい る。また Ti³⁺を起源とするシグナル C が観測さ れなかった。

5.まとめ

不純物ドープのない無色透明の anatase 型単結 晶の ESR 測定で観測された sextuplet シグナルは Al に由来するものであり、4 個のスピンが存在 し、スピンの主軸方向と結晶軸とのずれが 8.6° であるとわかった。低温でみられた Ti³⁺に由来



Fig. 6 酸素熱処理後の Al を 2mol%ドープした anatase 型単結晶の H//a での温度依存性

するシグナルは AI をドープすることで、紫外光照射のない状態でも観測された。これについては、5mol%の単結晶以外にも AI の濃度を変化させたサンプルを育成し ESR 測定を行う予定である。また、酸素雰囲気下での熱処理前後のシグナル変化に関しても、AI の濃度を変えたサンプルを数種類作り ESR 測定を行っていく予定である。

参考文献

[1] T. Sekiya, H. Takeda, N. Kamiya, S. Kurita, T. Kodaira, Phys. Stat. Sol. (c)3 (2006)3604.

[2] P. Meriaudeau, M. Che, P. C. Gravelle and S. J. Teichner, Bull. Soc. Chim. Fr. 1971, 13 (1971)